

## 高分解能走査電子顕微鏡更新のお知らせ

依頼試験、研究開発、県内企業への貸付に使用してきた走査電子顕微鏡 (SEM) を平成 16 年 3 月に更新しました。新しく設置されたものは高分解能形で FE-SEM と呼ばれています。

これまで同様に、製品中の異物分析や表面観察、微小部分の元素分析や県内企業の研究開発等に幅広く利用できます。

本装置は、ユーザーによる複雑な調整がほぼ不要で、ジョイスティックとマウス等で操作することができ、撮影した画像はデジタルデータとして保存できます。倍率は 20 万倍程度可能です。また、旧機と同様に元素分析機能 (EDS) を備えています。

(担当：材料科学部工業化学グループ 谷口)



【電界放出形走査電子顕微鏡】

### 【装置仕様】

- 装置名 : 高分解能走査電子顕微鏡  
(FE-SEM/EDS)
- 型式 : JSM-7400F/JED-2300F (日本電子製)
- 電子銃 : 電界放出形
- 分解能 : 1.0nm(15kV)、1.5nm(1kV)
- 元素分析 : ポイント、ライン、マッピング
- 使用料 : 観察 : 5,860 円/時間  
分析 : 6,990 円/時間
- 分析手数料  
観察 : 8,000 円(基本) 2,500 円(追加)  
分析 : 11,800 円(基本) 2,760 円(追加)